

Topografische Untersuchungen mittels phasenmessender Streifenprojektion

Einsatz

- Bestimmung topografischer Kennwerte von Oberflächen (Glätte, Rauigkeit)

Methode phasenmessende Streifenprojektion, GFM MikroCAD

Messbereich vertikal: > 300 nm; lateral: 1 µm

Grenzen transparente, glänzende Oberflächen

Anwendungsbeispiele

- Charakterisierung von Papieroberflächen
- Bewertung von Druckprodukten

